12

# (19) 日本国特許庁 (JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

# 特開平11-298792

(43)公開日 平成11年(1999)10月29日

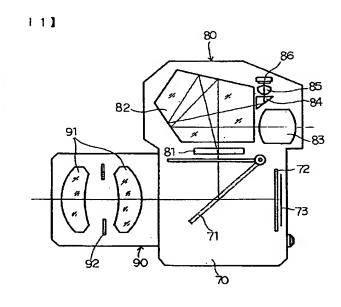
| (51) Int.Cl. 5            |       | 識別記号 | F                 | I      |         |                     |      |         |  |
|---------------------------|-------|------|-------------------|--------|---------|---------------------|------|---------|--|
| H04N                      | 5/232 |      | н                 | 04N    | 5/232   |                     | Z    |         |  |
| G 0 3 B                   | 7/08  |      | G                 | 3 B    | 7/08    |                     |      |         |  |
| H04N                      | 5/907 |      | H                 | 04N    | 5/907   | i/907 B             |      |         |  |
|                           | 5/91  |      |                   |        | 5/91 J  |                     |      |         |  |
|                           | 5/92  |      |                   |        | 5/92 H  |                     |      |         |  |
|                           |       |      | :                 | 審査請求   | え 未 対 水 | 請求項の数5              | OL   | (全 9 頁) |  |
| (21)出願番号 特願平10-106548     |       | (7:  | (71)出顧人 000004112 |        |         |                     |      |         |  |
|                           |       | ·    |                   |        | 株式会社    | 吐ニコン                |      |         |  |
| (22)出願日 平成10年(1998) 4月16日 |       |      |                   |        | 東京都     | 千代田区丸の内は            | 3丁目: | 2番3号    |  |
|                           |       |      | (7:               | 2) 発明者 | 日 田宗 注  | 道弘                  |      |         |  |
|                           |       |      |                   |        | 東京都     | 東京都千代田区丸の内3丁目2番3号 株 |      |         |  |
|                           |       |      |                   |        | 式会社:    | ニコン内                |      |         |  |
|                           |       |      | (7-               | 4)代理人  | 、弁理士    | 永井 冬紀               |      |         |  |
|                           |       |      |                   |        |         |                     |      |         |  |
|                           |       |      |                   |        |         |                     |      |         |  |
|                           |       |      |                   |        |         |                     |      |         |  |
|                           |       |      | ,                 |        |         |                     |      |         |  |
|                           |       |      |                   |        |         |                     |      |         |  |
|                           |       |      |                   |        |         |                     |      |         |  |
|                           |       |      | Ì                 |        |         |                     |      |         |  |

## (54) 【発明の名称】 電子スチルカメラ

## (57)【要約】

【課題】撮影シーンを解析して画像処理を行なう際の時間を短縮化する。

【解決手段】撮影レンズ91を通過する被写体像を撮像して画像データを出力する撮影用撮像装置73とは 撮影レンズ91に対して撮影用撮像装置73とは共役な位置に配置され、被写体像を受光してシーン解析用画像データを出力する解析用撮像装置86と、解析用撮像装置86から出力されるシーン解析用画像データに基づいて被写体像のシーンを解析する解析回路10と、解析回路10から出力されるシーン解析結果に基づいて画像処理を行なう画像処理回路24とを備える。撮影用撮像装置73とは別のシーン解析用画像装置86からのシーン解析用画像データによるシーン解析結果に基づいて階調カーブを決定したり、ホワイトバランス調整用のRゲインやBゲインを決定する。



2

### 【特許請求の範囲】

【請求項1】撮影レンズを通過する被写体像を撮像して 画像データを出力する撮影用撮像装置と、

前記撮影用撮像装置から出力される画像データに対して 画像処理を施す画像処理回路とを備えた電子スチルカメ ラにおいて、

前記撮影レンズに対して前記撮影用撮像装置とは共役な 位置に配置され、前記被写体像を受光してシーン解析用 画像データを出力する解析用撮像装置と、

前記解析用撮像装置から出力されるシーン解析用画像データに基づいて前記被写体像のシーンを解析する解析回路とを備え

前記画像処理回路は、前記解析回路から出力されるシーン解析結果に基づいて前記画像処理を行なうことを特徴とする電子スチルカメラ。

【請求項2】請求項1の電子スチルカメラにおいて、 前記解析回路は前記画像処理回路の各種画像処理に対応 する係数やゲインなどのパラメータを算出することを特 徴とする電子スチルカメラ。

【請求項3】請求項1の電子スチルカメラにおいて、前記画像処理回路は、前記撮影用撮像装置からの撮影用画像データに基づいて各種画像処理に対応する係数やゲインなどのパラメータを算出し、前記解析回路は、前記画像処理回路が前記パラメータを算出する際に使用する前記撮影用画像データの領域を算出することを特徴とする電子スチルカメラ。

【請求項4】撮影レンズを通過する被写体像がクイックリターンミラーによって導かれるファインダ装置と、前記クイックリターンミラーの後段に配置され前記被写体像を撮像して画像データを出力する撮影用撮像装置と、

前記撮影用撮像装置から出力される画像データに対して 画像処理を施す画像処理回路とを備えた一眼レフ電子ス チルカメラにおいて、

前記撮影レンズに対して前記撮影用撮像装置とは共役な 位置に配置され、前記クイックリターンミラーからファ インダ装置に導かれた被写体像を受光してシーン解析用 画像データを出力する解析用撮像装置と、

前記解析用撮像装置から出力されるシーン解析用画像データが入力され、前記画像処理に対応する係数やゲインなどのパラメータを予め算出する算出回路とを備え、前記画像処理回路は前記算出回路で算出される前記パラ

州記画家処理回路は刊記昇出回路(昇出される刊記)、メ メータを用いて前記画像処理を行なうことを特徴とする 一眼レフ電子スチルカメラ。

【請求項5】撮影レンズを通過する被写体像がクイックリターンミラーによって導かれるファインダ装置と、前記クイックリターンミラーの後段に配置され前記被写体像を撮像して画像データを出力する撮影用撮像装置と、

前記撮影用撮像装置から出力される画像データに対して 50

画像処理を施す画像処理回路とを備えた一眼レフ電子ス チルカメラにおいて、

前記撮影レンズに対して前記撮影用撮像装置とは共役な 位置に配置され、前記クイックリターンミラーからファ インダ装置に導かれた被写体像を受光してシーン解析用 画像データを出力する解析用撮像装置を備え、

前記解析用撮像装置から出力されるシーン解析用画像データに基づいて前記被写体像のシーンを解析する解析回 路とを備え、

前記画像処理回路は、前記撮影用撮像装置からの撮影用画像データに基づいて各種画像処理に対応する係数やゲインなどのパラメータを算出し、前記解析回路は、前記画像処理回路が前記パラメータを算出する際に使用する前記撮影用画像データの領域を算出することを特徴とする一眼レフ電子スチルカメラ。

# 【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、被写体を電子的な 画像データとして記録する電子スチルカメラに関する。

#### [0002]

【従来の技術】従来から一眼レフ電子スチルカメラが知られている。この一眼レフ電子スチルカメラは、撮影レンズを通過する被写体像がクイックリターンミラーによって導かれるファインダ装置と、クイックリターンミラーの後段に配置され被写体像を撮像して画像データを出力するCCDのような撮像装置と、撮像装置から出力される画像データに対してホワイトバランスやγ補正などの画像処理を施す画像処理回路と、画像処理後のデータをJPEGなどの方式で圧縮してフラッシュメモリなどの記憶媒体に記憶する圧縮回路と、画像処理後のデータを表示するモニタとを備える。画像処理回路では、撮像装置から出力される画像データに基づいて、予め定めたアルゴリズムによりホワイトバランス調整用のRゲインやBゲイン、あるいはγ補正用の階調カーブなどのパラメータを算出する。

## [0003]

【発明が解決しようする課題】このような一眼レフ電子スチルカメラにあっては、撮像装置の画素数が年々増加し、100万あるいは200万画素を越えると画像処理に要する時間が長くなる傾向にある。とくに高画質処理を実現するためにγ補正用の階調カーブを算出する場合には、撮影シーンの解析に時間がかかる他、画像処理回路の規模も大きく複雑になる。また、撮像装置の画素数が多くなるとホワイトバランス調整用RゲインやBゲインを算出する際にも時間がかかる。なお、このような問題は、100万~200万画素を越える撮像装置を有する種々のタイプの電子スチルカメラにも同様に起き得るものである。

【0004】本発明の目的は、撮影シーンを解析して画像処理を行なう際の時間を短縮化することのできる電子

Ġĸ.

7.3

200

rn annadarbhad an bha a' luill ann bail

スチルカメラを提供することにある。

## [0005]

【課題を解決するための手段】一実施の形態を示す図1 および図2を参照して本発明を説明する。

- (1) 請求項1の発明は、撮影レンズ91を通過する被 写体像を撮像して画像データを出力する撮影用撮像装置 73と、撮影用撮像装置73から出力される画像データ に対して画像処理を施す画像処理回路24とを備えた電 子スチルカメラに適用される。そして、撮影レンズ91 に対して撮影用撮像装置73とは共役な位置に配置さ れ、被写体像を受光してシーン解析用画像データを出力 する解析用撮像装置86と、解析用撮像装置86から出 力されるシーン解析用画像データに基づいて被写体像の シーンを解析する解析回路10とを設け、画像処理回路 24により、解析回路10から出力されるシーン解析結 🔅 果に基づいて画像処理を行なうことにより、上述した目 的を達成する。
- (2) 請求項2の発明は、請求項1の電子スチルカメラ において、解析回路10は画像処理回路24の各種画像 処理に対応する係数やゲインなどのパラメータを算出す ることを特徴とする。
- (3) 請求項3の発明は、請求項1の電子スチルカメラ において、画像処理回路24によって、撮影用撮像装置 73からの撮影用画像データに基づいて各種画像処理に 対応する係数やゲインなどのパラメータを算出し、解析 回路10によって、画像処理回路24がパラメータを算 出する際に使用する撮影用画像データの領域を算出する ことを特徴とする。
- (4) 請求項4の発明は、撮影レンズ91を通過する被 写体像がクイックリターンミラー71によって導かれる ファインダ装置80と、クイックリターンミラー71の 後段に配置され被写体像を撮像して画像データを出力す る撮影用撮像装置73と、撮影用撮像装置73から出力 される画像データに対して画像処理を施す画像処理回路 24とを備えた一眼レフ電子スチルカメラに適用され る。そして、撮影レンズ91に対して撮影用撮像装置7 3とは共役な位置に配置され、クイックリターンミラー 71からファインダ装置80に導かれた被写体像を受光 してシーン解析用画像データを出力する解析用撮像装置 86と、解析用撮像装置86から出力されるシーン解析 用画像データが入力され、画像処理に対応する係数やゲ インなどのパラメータを予め算出する算出回路10とを 設け、画像処理回路24によって、算出回路10で算出 されたパラメータを用いて画像処理を行なうことにより 上述した目的を達成する。
- (5) 請求項5の発明は、撮影レンズ91を通過する被 写体像がクイックリターンミラー71によって導かれる ファインダ装置80と、クイックリターンミラー71の 後段に配置され被写体像を撮像して画像データを出力す る撮影用撮像装置73と、撮影用撮像装置73から出力

される画像データに対して画像処理を施す画像処理回路 24とを備えた一眼レフ電子スチルカメラに適用され る。そして、撮影レンズ91に対して撮影用撮像装置7 3とは共役な位置に配置され、クイックリターンミラー 71からファインダ装置80に導かれた被写体像を受光 してシーン解析用画像データを出力する解析用撮像装置 86と、解析用撮像装置86から出力されるシーン解析 用画像データに基づいて被写体像のシーンを解析する解 析回路10とを設け、画像処理回路24によって、撮影 用撮像装置73からの撮影用画像データに基づいて各種 画像処理に対応する係数やゲインなどのパラメータを算 出し、解析回路10によって、画像処理回路24がパラ メータを算出する際に使用する撮影用画像データの領域 を算出することにより、上述した目的を達成する。

【0006】なお、本発明の構成を説明する上記課題を 解決するための手段の項では、本発明を分かり易くする ために実施の形態の図を用いたが、これにより本発明が 実施の形態に限定されるものではない。

#### [0007]

【発明の実施の形態】以下、図面を参照して本発明の実 施の形態を説明する。 図1に示すように、この実施の 形態による一眼レフ電子スチルカメラは、カメラ本体7 0と、カメラ本体70に着脱されるファインダ装置80 と、撮影レンズ91と絞り92を内蔵してカメラ本体7 0に着脱される交換レンズ90とを備える。被写体光は 交換レンズ90を通ってカメラ本体70に入射し、レリ ーズ前は点線で示す位置にあるクイックリターンミラー 71でファインダ装置80に導かれてファインダマット 81に結像する。その被写体像はさらにペンタプリズム 82で接眼レンズ83に導かれる。また、被写体像はペ ンタプリズム82からプリズム84、光学素子85によ りシーン解析用撮像装置86の受光面上に結像する。一 方、レリーズ後はクイックリターンミラー71が実線で 示す位置に回動し、被写体光は絞り72を介して撮影用 撮像装置73上に結像する。シーン解析用撮像装置86 は撮影レンズ91に対して撮影用撮像装置73と共役な 位置に配設される。

【0008】図2は実施の形態の回路ブロック図であ る。半押しスイッチ11が操作されると、解析用撮像装 置86が電荷蓄積を開始し、蓄積終了後、解析用撮像装 置86はシーン解析用RGB画像データを解析回路10 に入力する。解析回路10はその画像データをデジタル 信号に変換し、さらにデジタル画像信号に基づいて撮影 シーンを解析する。その解析結果は画像データ用制御回 路21へ転送される。

【0009】一方、全押しスイッチ12が操作されると クイックリターンミラー71が上方に回動し、交換レン ズ90からの被写体光は撮影用撮像装置73の受光面上 で結像し、撮影用撮像装置73には被写体像の明るさに 応じた信号電荷が蓄積される。撮影用撮像装置73に蓄

1212 1.2

. 324

· 中央地域 医动脉

ilij ilij

6

積された信号電荷は、アナログ信号処理回路22により ゲインコントロール等のアナログ処理が施された後、A / D変換回路23によってデジタル信号に変換される。 デジタル変換された信号は画像処理回路24に導かれ、そこでホワイトバランス調整、輪郭補償、ガンマ補正等 の画像処理が行われてフォーマット化され、フレームメモリコントローラ25を通ってフレームメモリ26に一時的に格納される。画像処理回路24で行なわれる画像 処理に用いられる各種のパラメータはシーン解析回路10で予め算出されて制御回路21のメモリ内に記憶されている。

【0010】フレームメモリ26に記憶された画像データは、表示画像作成回路27により表示用の画像データに処理され、LCD等の外部モニタ28に撮影結果として表示される。また、フレームメモリ26に記憶された画像データは、圧縮回路29によりJPEG等の方式で所定の比率にデータ圧縮を受け、フラッシュメモリ等のカメラ内メモリ(記憶媒体)30に記録される。

【0011】次に、シーン解析用撮像装置86とシーン解析回路10について詳細に説明する。シーン解析用撮 20像装置86はたとえば図3に示すように横24列×縦20行に分割された480個の画素を有する1枚の2次元 CCDである。撮像装置86の表面には図4に示すように、480画素に対応して横24列×縦20行の480ブロックに分割されたRGBカラーフィルタ861が配設されている。480ブロックのRGBフィルタを図4に示すように、それぞれが横6列×縦5行のフィルタ素子を有する16個のブロックB11,B12……B43,B44にグルーピングしてシーン解析に利用する。ここで、シーン解析とは、たとえば撮影シーンの輝度情 30 報、RGB信号の分布状態等に関する解析を意味する。

【0012】次に、シーンを解析して階調カーブを決定 する手順を図5~図7を参照して説明する。半押しスイー ッチ11が操作されると図5に示すプログラムが起動さ れ、ステップS1において、シーン解析用撮像装置86 はその受光面上に結像する被写体光による電荷を所定時 間蓄積し、その後、蓄積したRGB画像データをシーン 解析回路10に順次に吐き出す。ステップS2では、4 80 画素すべての輝度値Y i j (ただし、i = 20、j =24)を算出し、ステップS3でその全平均値Yave を算出する。ステップS4では、16個のブロックB1 1~B44ごとのブロック平均輝度値Yavel~Yavel6 を算出する。ステップS5に進むと、ブロック平均輝度 値Yavel~Yavel6のそれぞれの差を求め、その差が最 大となる輝度差の絶対値Yabsを算出する。ステップS 6では、絶対値Yabsと予め定めしきい値Ymaxとの大小 比較を行なってシーンを解析する。そして、ステップS 7において、予め図6 (a) ~ (d) のような4種類の 階調カーブのいずれを使用するかをシーン解析結果に基 づいて以下のように決定する。

【0013】(1)最大の輝度差の絶対値Yabsが予め定めたしきい値Ymax未満であれば、撮影シーンは中間調重視タイプと判断する。中間調重視タイプの場合には図6(a)に示すS字状階調補正カーブとする。これにより、中間調に階調が確保される。

【0014】(2)最大の輝度差の絶対値Yabsが予め 定めたしきい値Ymax以上である場合には、次式のよう に、全画素平均輝度差Yaveと各ブロック平均輝度Yave [i]との差Ydiff[i]を算出する。

【数1】Ydiff[i]=Yave-Yave[i] ただし、iは1~16の整数

Ydiff[i]が予め定めたしきい値Yhilightより小さくなっているブロック、あるいは、予め定めたしきい値Yshadowより大きくなっているブロックが複数個隣接しているかを調べ、その結果に基づいて次のようにシーンを解析する。ここで、しきい値Yhilight<しきい値Yshadowである。

【0015】(2-1)しきい値Yhilightより小さくなっているブロックが複数個隣接している場合には、ハイライト重視タイプと判断する。ハイライト重視タイプの場合には図6(b)に示す階調補正カーブとする。これにより、中間調からハイライトにかけて階調が確保される。(2-2)しきい値Yshadowより大きくなっているブロックが複数個隣接している場合には、シャドウ重視タイプと判断する。シャドウ重視タイプの場合には図6(c)に示す階調補正カーブとする。これにより、シャドウから中間調にかけて階調が確保される。

(2-3) しきい値Yhilightより小さくなっているブロックが複数個隣接し、かつ、しきい値Yshadowより大きくなっているブロックが複数個隣接している場合には、ハイライトーシャドウ重視タイプと判断する。ハイライトーシャドウ重視タイプの場合には図6(d)に示す階調補正カーブとする。これにより、シャドウ部とハイライト部の階調が確保される。

【0016】さらにステップS8において、各々の階調カーブの勾配やγ値を、全輝度平均値Yave、ブロック平均輝度値Yavel~Yavel6、Ydiff [i] などを利用して算出し、これらのデータを使用して最終的な階調カーブが決定される。ステップS9では、このようにして算出された階調カーブを撮影用制御回路21に転送する。これにより、制御回路21はメモリ内に階調カーブを記憶する。そしてステップS10で全押しされるまで上記ステップS1~ステップS9を繰り返す。

【0017】全押しスイッチ12が操作されると、クイックリターンミラーが跳ね上がり、図7に示す撮影シーケンスのプログラムが起動される。ステップS21では、撮像装置73の各画素が受光信号を蓄積し、蓄積終了後、全画素の蓄積電荷を順次に吐き出す。ステップS22において、吐き出された画像データはアナログ信号処理回路22で処理された後、A/D変換回路23でデ

1.

.... :...

puller statue i al leggi upport de una li i Marka par Pitti de un dell'i di la li un un un della con i di la l

ジタル画像データに変換され、画像処理回路24に入力される。次にステップS23に進み、シーン解析回路10で予め算出されてメモリに記憶されている階調カーブを使用して画像データが階調補正される。なお、ホワイトバランス調整なども画像処理回路24で行なわれる。画像処理が終了するとステップS24に進み、画像処理後の画像データをいったんフレームメモリ26に記憶する。ステップS25では圧縮回路29によりJPEG方式で画像データを圧縮し、その後、ステップS26で圧縮画像データを記憶媒体30に記憶する。

【0018】このように、この実施の形態では、半押しスイッチ11が操作されると、シーン解析回路10で階調カーブが算出され、制御回路21に転送されてメモリに記憶される。階調カーブの演算は半押しスイッチ11が操作されている間、繰り返して実行され、最新のデータがメモリに書換えられる。そして、全押しスイッチ12が操作されて撮影用撮像装置73に被写体光が結像すると、撮像装置73は被写体光による電荷を所定時間蓄積して順次に出力する。画像処理回路24は予め記憶されている階調カーブを使用して階調補正するので、データ量の膨大な撮影用画像データそのものを使用して階調カーブを算出する必要がなく、階調補正処理時間が短縮される。

【0019】次に、シーン解析結果に基づいてホワイトバランス調整に使用するRゲインとBゲインを算出する手順について図8のフローチャートを参照して説明する。ステップS31でシーン解析用撮像装置86に受光される被写体光により電荷を所定時間蓄積し、その後、シーン解析用RGB画像データを順次にシーン解析回路10に吐き出す。ステップS32では、シーン解析用撮 30像装置86と撮影用撮像装置73とのカラー特性の相違を補償するマッチング処理を行なう。マッチング処理は、たとえば3×L(L≧3)のマトリックス定数と生のRGBデータとの間でマークリックス演算を行なう処理である。

【0020】ステップS33では、480画素すべてのRGB信号を用いてRゲイン全画素平均値RgaveとBゲイン全画素平均値Bgaveを算出する。ステップS34では、16個のブロックB11~B44ごとのRゲインブロック平均値Rgavel~Rgavel6と、Bゲインブロック平均値Bgavel~Bgavel6を算出する。

【0021】ステップS35に進むと、Rゲイン全画素 平均値RgaveとRゲインブロック平均値Rgave1~Rgave16のそれぞれのゲイン差の絶対値Rgdif1~Rgdif16 と、Bゲイン全画素平均値BgaveとBゲインブロック平 均値Bgave1~Bgave16のそれぞれのゲイン差の絶対値Bgdif1~Bgdif16を次式に基づいて算出する。

【数2】Rgdif[i] = | Rgave-Rgave[i] | Bgdif[i] = | Bgave-Bgave[i] | ただし、iは1~16の整数 【0022】ステップS36では、ゲイン差の絶対値R gdif1~Rgdif16のそれぞれをしきい値Rdifmaxと比較するとともに、ゲイン差の絶対値Bgdif1~Bgdif16のそれぞれをしきい値Bdifmaxと比較する。この比較に基づいて以下のようにホワイトバランス用RゲインとBゲインを決定する。

【0023】(1) ゲイン差の絶対値Rgdifl~Rgdifl 6のそれぞれがしきい値Rdifmax未満であれば、Rゲイン全画素平均値RgaveをRゲインとして決定する。ゲイン差の絶対値Bgdifl~Bgdifl6のそれぞれがしきい値 Bdifmax未満であれば、Bゲイン全画素平均値Bgaveを Bゲインとして決定する。

【0024】(2)ゲイン差の絶対値Rgdifl~Rgdifl 6のいずれかがしきい値Rdifmax以上である場合には、しきい値Rdifmax未満のゲイン差の絶対値をもつブロックを選択し、それら1もしくは複数のブロックにおけるゲイン差の絶対値Rgdifiの総和に基づいて算出した平均値をRゲインとして決定する。また、ゲイン差の絶対値Bgdifl~Bgdifl6のいずれかがしきい値Bdifmax以上である場合には、しきい値Bdifmax未満のゲイン差の絶対値をもつブロックを選択し、それら1もしくは複数のブロックにおけるゲイン差の絶対値Bgdifiの総和に基づいて算出した平均値をBゲインとして決定する。

【0025】ステップS37では、このようにして算出されたRゲインとBゲインを撮影用制御回路21に転送する。これにより、制御回路21はメモリ内にRゲインとBゲインを記憶する。そしてステップS38で全押しされるまで上記ステップS31~ステップS37を繰り返す。

【0026】全押しスイッチ12が操作されると、クイックリターンミラー71が跳ね上がり、図7に示す撮影シーケンスのプログラムが起動される。ステップS21では、撮像装置73の各画素が受光信号を蓄積し、蓄積終了後、全画素の蓄積電荷を順次に吐き出す。ステップS22において、吐き出された画像データはアナログ信号処理回路22で処理された後、A/D変換回路23でデジタル画像データに変換され、画像処理回路24に入力される。次にステップS23に進み、シーン解析回路10で予め算出されてメモリに記憶されているRゲインとBゲインを使用して画像データのホワイトバランス調整が行なわれる。なお、画像処理回路24により階調カーブによるγ補正や輪郭補償などその他の画像処理も行なわれる。

て撮影用撮像装置 7 3 に被写体光が結像すると、撮像装置 7 3 は被写体光による電荷を所定時間蓄積して順次に出力する。その画像データに対して、画像処理回路 2 4 は予め記憶されている R ゲインと B ゲインを使用してホワイトバランス調整を行なう。したがって、データ量の膨大な撮影用画像データそのものを使用してホワイトバランス調整用 R ゲインと B ゲインを算出する必要がなく、ホワイトバランス調整時間が短縮される。また、図9に示すように、たとえば赤い看板 R B を背景にした人物シーンなどでは、赤色に偏っている領域を除外してホワイトバランス調整ができ、人物の肌色などの色を忠実に表現できる。

【0028】なお、階調カーブと、ホワイトバランス用 RゲインおよびBゲインとをシーン解析回路10で算出 して画像処理回路24に転送して記憶しておき、これら のパラメータを使用して、階調カーブによる高画質処理 とホワイトバランス調整の双方を行なってもよい。

【0029】また以上では、シーン解析用撮像装置86 の画像データに基づいて、解析回路10で階調カーブや RゲインおよびBゲインを算出して撮影用制御回路21 へ予め転送して記憶するようにした。しかしながら、ホ ワイトバランス調整については、シーン解析結果に基づ いて、ゲイン差の絶対値がしきい値未満にあるブロック を選択し、そのブロックの位置に関する情報を制御回路 21に転送し、制御回路21では撮影用撮像装置73か らの画像データのうち、ブロック位置情報に対応した領 域内の撮影用画像データを用いてホワイトバランス調整 用RゲインおよびBゲインを算出するようにしてもよ い。すなわち、シーン解析回路10はRゲインとBゲイ ンを算出するための画像データの領域だけを算出する。 さらに、本発明は一眼レフ電子スチルカメラに限らず、 画素数の多い(例えば100万画素以上)種々のタイプ の電子スチルカメラに適用することができる。

## [0030]

【発明の効果】以上詳細に説明したように本発明によれ ば次のような効果を奏する。

(1)請求項1,2および4の発明によれば、撮影用撮像装置と共役な位置に配置したシーン解析用撮像装置か

らのシーン解析用画像データで予め画像処理のパラメータを算出するようにしたので、シーン解析結果に基づいた画像処理を従来に比べて短時間で行なうことができる。

(2)請求項3および5の発明によれば、撮影用撮像装置と共役な位置に配置したシーン解析用撮像装置に基づいて予め画像処理に利用する撮影用撮像装置の画像領域を算出するようにしたので、シーン解析結果に基づいた画像処理を従来に比べて短時間で行なうことができる。

### 【図面の簡単な説明】

【図1】一眼レフ電子スチルカメラの一実施の形態の構成を示す図

【図2】一眼レフ電子スチルカメラの信号処理系統の一 実施の形態のブロック図

【図3】シーン解析用撮像装置の一例を示す図

【図4】シーン解析用撮像装置のカラーフィルタを説明 するとともに16のプロックにグルーピングする一例を 説明する図

【図5】半押しスイッチで起動されるプログラムを示すフローチャート

【図6】階調カーブを示す図

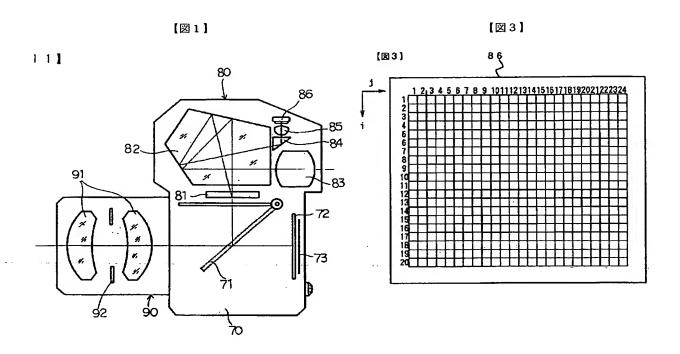
【図7】全押しスイッチで起動されるプログラムを示す フローチャート

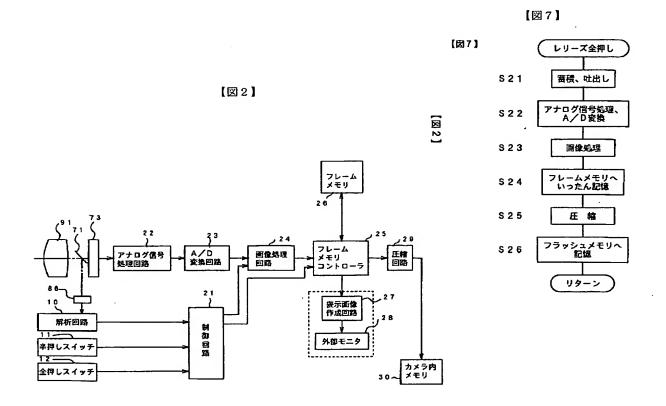
【図8】半押しスイッチで起動される他のプログラムを 示すフローチャート

【図9】赤色の背景の中に人物が位置する場合を示す図 【符号の説明】

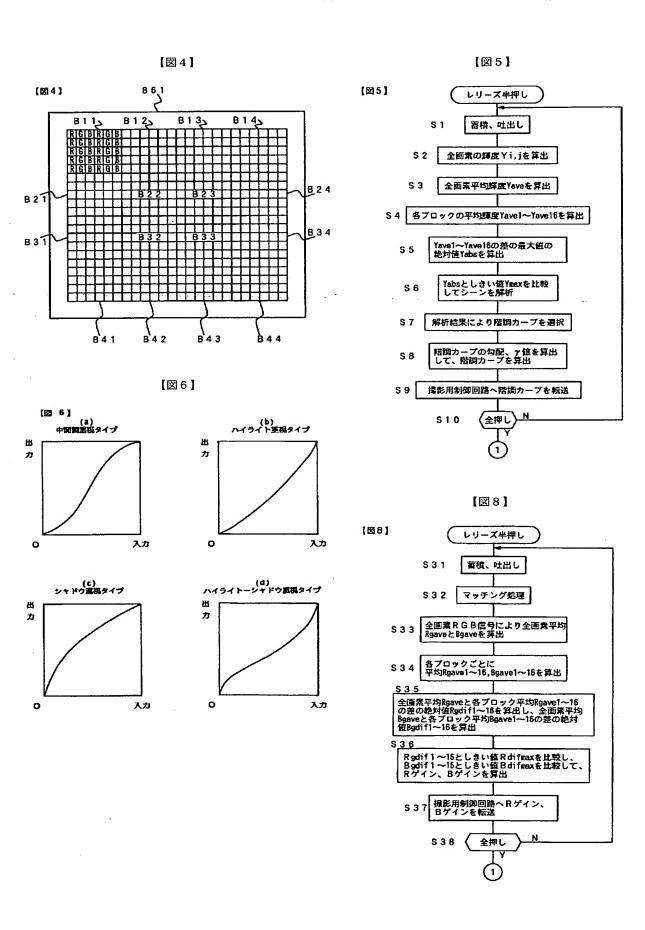
- 10 シーン解析回路
- 11 半押しスイッチ
- 12 全押しスイッチ
  - 21 制御回路
  - 24 画像処理回路
  - 70 カメラ本体
  - 71 クイックリターンミラー
  - 73 撮影用撮像装置
  - 80 ファインダ装置
  - 86 シーン解析用撮像装置
  - 91 撮影レンズ

ý:





THE GOOD TO STATE OF A

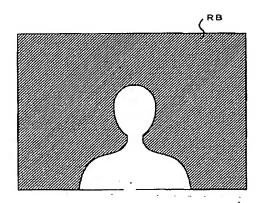


特開平11-298792

[図9]

(9)

[図9]



The state of the s